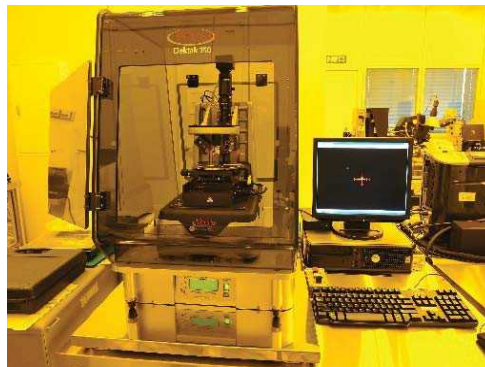


触針式表面形状・膜厚段差測定装置（ビーコ：Dektak150）

直径150mm以下の基板上の膜厚段差、表面粗さ、うねりなどの表面形状を高精度に測定する最新の触針式表面形状測定器です。

Au、Ag、Alや有機薄膜などの柔らかい薄膜でも膜表面を傷つけることなく測定することができ、微細加工された溝深さなども測定できます。



【仕様】

垂直表示レンジ	6.5nm～524μm
垂直方向分解能／測定レンジ	0.1nm／6.5μm、1nm／65.5μm、8nm／524μm（オプション）
垂直分解能（最高）	0.1nm
膜圧測定再現性	1σ=0.6nm以下
測定距離	50μm～55mm
測定時間	3～400秒
触針圧	1～15mg
触針半径（標準）	12.5μmR
サンプルステージサイズ	直径 150mm
ステージ移動範囲	X：±50mm Y：+75mm、-25mm θ：360°
解析パラメータ	（30種類）
粗さ解析パラメータ	Ra、Rq、Rp、Rv、Rt、Rz_din、MaxRa、Maxdev、Skew
うねり解析パラメータ	Wa、Wq、Wp、Wv、Wt、Wmaxdev
高さ解析パラメータ	ASH、AvgHt、Peak、Valley、P_V、TIR、Pc、HSC
幾何学パラメータ	Area、Slope、Volume、Radius、Perim、Sm、Tp

設置場所 C10棟クリーンルーム（クラス10）

カテゴリ 計測